

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 738 907**

21 Número de solicitud: 201830756

15 Folleto corregido: A1

INID afectado: 72

48 Fecha de publicación de la corrección: 07.07.2020

51 Int. Cl.:

F24S 50/80 (2008.01)

G01B 11/00 (2006.01)

G01B 9/00 (2006.01)

12

**CORRECCIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA
DE LA SOLICITUD DE PATENTE**

A8

22 Fecha de presentación:

25.07.2018

43 Fecha de publicación de la solicitud:

27.01.2020

71 Solicitantes:

**FUNDACIÓN CENER-CIEMAT (100.0%)
Ciudad de la Innovación nº 7
31621 Sarriguren (Navarra) ES**

72 Inventor/es:

**LES AGUERREA, Iñigo;
MUTUBERRIA LARRAYOZ, Amaia;
PEÑA LAPUENTE, Adrián;
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Marcelino;
HERAS VILA, Carlos;
SALINA ÁRIZ, Iñigo;
IZQUIERDO NÚÑEZ, David y
GARCÍA-BARBERENA LABIANO, Javier**

74 Agente/Representante:

ARIZTI ACHA, Monica

54 Título: **DISPOSITIVO, SISTEMA Y PROCEDIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS REFLECTORES A PARTIR DE LOS HACES DE LUZ REFLEJADOS EN LOS MISMOS**

57 Resumen:

Dispositivo, sistema y procedimiento de caracterización de elementos reflectores a partir de los haces de luz reflejados en los mismos y en concreto a partir de la calidad de dichos haces de luz. El dispositivo comprende al menos dos detectores de ganancia variable dispuestos sobre una estructura común, que puede ser portable o fija, y dispuesta para captar los haces de luz reflejados por al menos un elemento reflector, preferiblemente un heliostato, y a partir de al menos un procesador caracterizar la calidad de dichos haces de luz reflejados y por lo tanto evaluar la calidad del elemento reflector o heliostato a partir de su capacidad reflectora. Asimismo, cada detector comprende una lente para aumentar la relación señal-ruido del haz o haces reflejados, al menos un sensor de luz en el que se focalizan el haz o haces captados por la lente, un sistema automático de selección de la ganancia asociado al sensor óptico y unos medios de comunicación de datos asociados al propio dispositivo. Asimismo, la invención se refiere a un sistema y a un procedimiento de caracterización de elementos reflectores, heliostatos, a partir de la calidad de los haces de luz reflejados en al menos un elemento reflector o heliostato.

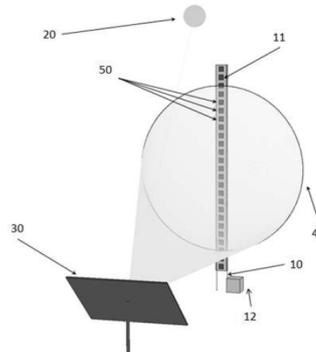


FIG 1

ES 2 738 907 A8